

超高信頼VLSIへのアプローチ

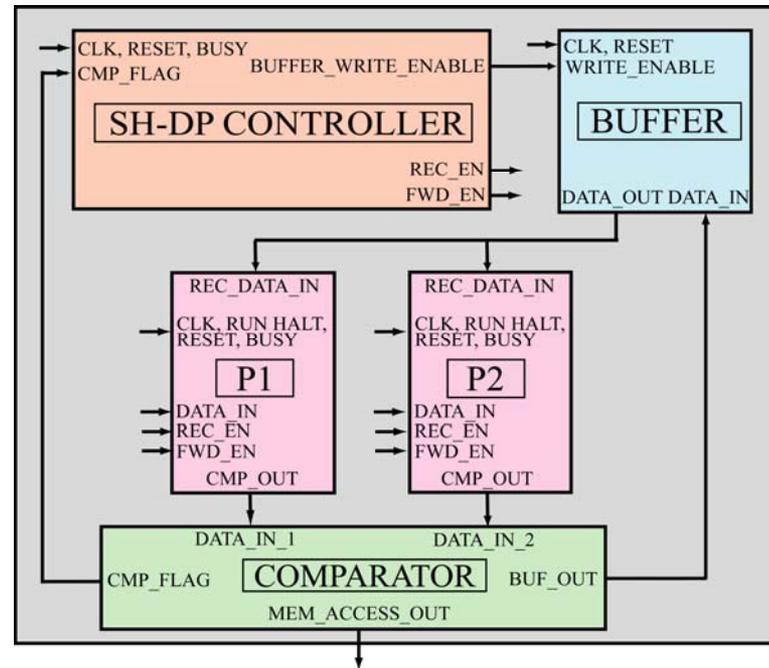
システムデザイン学部情報通信システムコース 准教授
福本 聡 福本研究室

E-mail: s-fuku@tmu.ac.jp

URL: <http://www.sd.tmu.ac.jp/RDstaff/ice.html>



1. 半導体の安定動作にたちはだかる壁
2. 設計検証による高信頼化
3. テスト技術によつ高信頼化
4. 過渡故障への対策
5. セキュアプロセッサへのアプローチ



耐過渡故障プロセッサの構成例